

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม

INTEGRATED CIRCUIT TESTING MANAGEMENT
AND TRACKING SYSTEM



T139274

โดย

พิษณุ เพ็ญสมบุญ

PIDSANU PENSOMBOON

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์

กท.
๗๗๖๔๖
๒๕๕๖

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน..... 139274
วันเดือนปี..... 30 ต.ค. 2558



b.12721232

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาระดับ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**INTEGRATED CIRCUIT TESTING MANAGEMENT
AND TRACKING SYSTEM**



**A REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS OF THE COURSE
INDEPENDENT STUDY 2
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

2/2013

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



COPYRIGHT 2014

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อ	ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม
นักศึกษา	นาย พิษณุ เพ็ญสมบุญ
รหัสนักศึกษา	52660710
ปริญญา	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา	เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ปีการศึกษา	2556
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. ภัทรชัย กลิตโรจน์วงศ์

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการและติดตามที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบของการทดสอบวงจรรวม ทำให้เวลาถือครองเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้อัตราการถือครองครองลดลง ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมจึงได้รับการพัฒนาขึ้นอยู่บนพื้นฐานของภาษา C# และ MySQL DBMS ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บรายงานการถือครอง อีกทั้งยังแจ้งคำแนะนำแก่ผู้ใช้งานด้วยอีเมล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเพิ่มระยะเวลานำของลูกค้าอีกด้วย

Title	Integrated Circuit Testing Management and Tracking System
Student	Mr. Pidsanu Pensomboon
Student ID	52660710
Degree	Master of Science
Program	Information Technology
Major	Information Technology Management
Academic Year	2013
Advisor	Assist Prof. Dr. Pattarachai Lalitrojwong

ABSTRACT

Inefficient management and tracking system of integrated circuit testing causes the increased holding time in the production process, resulted in the delay of delivering products to customers. To achieve the reduction of holding time, the new information system was developed based on C# language and MySQL DBMS. The features enable users to create, edit, search and store the reports of hold lots as well as inform relevant instruction or process to users by e-mail. This information system will potentially help increasing the production performance by providing easy and quick access for users to an accurate database and thus, improvement of lead time to customers.

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาอิสระนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคำตักเตือนจากอาจารย์ที่ปรึกษา ศศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาโครงการนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำหรับความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา กัลยาณมิตร และครอบครัวของข้าพเจ้า รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ซึ่งเป็นกำลังใจอันดีแก่ข้าพเจ้าจนทำให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดังนั้นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้มาจากการพัฒนาโครงการฉบับนี้ จึงขอบอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

พิชณู เพ็ญสมบุญ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ.....	2
1.3 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ.....	2
1.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ.....	4
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ.....	4
2.2 ระบบฐานข้อมูล.....	5
บทที่ 3 การทำงานของระบบปัจจุบัน.....	6
3.1 ธุรกิจการผลิตแผงวงจรรวม.....	6
3.2 ขั้นตอนการทำงานในระบบปัจจุบัน.....	9
3.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน.....	15
3.4 แนวทางการแก้ไข.....	16
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่.....	17
4.1 การทำงานของระบบใหม่.....	17
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบตามแนวคิดเชิงวัตถุ.....	17
4.3 การออกแบบฐานข้อมูล.....	31
บทที่ 5 การออกแบบหน้าจอและรายงาน.....	38
5.1 การอิมพลีเมนต์ระบบ.....	38
5.2 การพัฒนาระบบและหน้าจอการทำงาน.....	38

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 บทสรุป.....	42
6.1 สรุปโครงการ.....	42
6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	42
6.3 ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ.....	42
บรรณานุกรม.....	44
ประวัติผู้เขียน.....	45



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 คำอธิบายยูสเคสสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ	18
4.2 คำอธิบายยูสเคสดูแบบบันทึกผลการทดสอบ	23
4.3 คำอธิบายยูสเคสจัดการลือตงานที่กักไว้.....	25
4.4 คำอธิบายยูสเคสการสร้างผู้ใช้งาน	29
4.5 คำอธิบายยูสเคสการลบแบบบันทึกผลการทดสอบ	29
4.6 ข้อมูลพนักงาน (Employee).....	33
4.7 ข้อมูลตำแหน่งพนักงาน (Position).....	33
4.8 ข้อมูลธุรกิจสินค้า (BusinessLine).....	33
4.9 ข้อมูลเครื่องทดสอบ (Tester).....	34
4.10 ข้อมูลเครื่องลำเลียงเฟรม (Handler)	34
4.11 ข้อมูลบอร์ดทดสอบ (Board).....	34
4.12 ข้อมูลลือตงาน (Lot).....	34
4.13 ข้อมูลเอกสารลือตงานที่ต้องการจัดเก็บ (Upload file).....	35
4.14 ข้อมูลรายละเอียดแบบบันทึกผลการทดสอบ (PPO).....	35
4.15 ข้อมูลผลการตรวจสอบลือตงานกับ โปรแกรมประยุกต์เว็บปี	36
4.16 ข้อมูลผลการตรวจสอบลือตงานกับ โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ซี.....	37

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1	โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรรวม 6
3.2	แผ่นเวเฟอร์ 7
3.3	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวม 7
3.4	กระบวนการผลิตแผงวงจรรวม 8
3.5	เฟรมและผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมหลังกระบวนการ Post Cure 8
3.6	สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบการทดสอบแผงวงจรรวม..... 9
3.7	หน้าเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์เว็บปี 10
3.8	โปรแกรมประยุกต์เว็บปีในกรณีลือตงานถูกกักไว้ 10
3.9	โปรแกรมประยุกต์เว็บปีในกรณีลือตสามารถถูกลบไปยังกระบวนการถัดไปได้..... 10
3.10	หน้าต่างแสดงผลลัพธ์โปรแกรมประยุกต์วินโดว์ซี 11
3.11	หน้าต่างแสดงผลลัพธ์โปรแกรมประยุกต์วินโดว์ดับเบิลยู..... 12
3.12	ตัวอย่างแบบบันทึกผลการทดสอบ..... 13
4.1	แผนภาพยูสเคสของระบบใหม่.....18
4.2	เอกทิวทัศน์ไออะแกรมการสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ 21
4.3	หน้าจอสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบใหม่เมื่อนักงานเลือกลือต 22
4.4	หน้าจอการส่งอีเมลให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 23
4.5	หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกการทดสอบ 25
4.6	เอกทิวทัศน์ไออะแกรมการจัดการลือตงานที่กักไว้..... 27
4.7	หน้าจอแก้ไขเพิ่มเติมแบบบันทึกผลการทดสอบ 28
4.8	สเตทชาร์ตไออะแกรมของแบบบันทึกผลการทดสอบ 30
4.9	อีอาร์ไออะแกรมของระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม 31
5.1	ผังโครงสร้างระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม.....39
5.2	หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน 40
5.3	หน้าจอลือตอินเข้าสู่ระบบ..... 41

VII

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

แผนวงจรรวมนับว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเห็นได้รอบตัวเรา ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สมอกลงในรถยนต์ หรือแม้กระทั่งอาวุธนำวิถีทางการทหาร ล้วนจะต้องประกอบด้วยแผนวงจรรวมทั้งสิ้น ซึ่งภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบด้วยแผนวงจรรวมจำนวนมาก แผนวงจรรวมแต่ละชิ้นจะทำงานแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ทำงานได้หลากหลาย และมีความแม่นยำในการวัดและประมวลผลสูง อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การพัฒนาชิ้นส่วนแผนวงจรรวมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงและมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

การทดสอบทางไฟฟ้าของแผนวงจรรวมที่อยู่บนเฟรมเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่สำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการตรวจสอบและรับประกันคุณสมบัติทางไฟฟ้าและฟังก์ชันการทำงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้โดยปราศจากข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตาม กระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าบนเฟรมนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบ (หรือเรียกว่า Tester) ที่มีความสามารถสูง และใช้เครื่องลำเลียงเฟรม (หรือเรียกว่า Handler) ที่สามารถลำเลียงเฟรมงานได้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์แผนวงจรรวมที่มาจากกระบวนการก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันแต่ละวันจะมีผลิตภัณฑ์แผนวงจรรวมที่อยู่บนเฟรมซึ่งรอการทดสอบทางไฟฟ้าจำนวนหลายล็อต โดยแต่ละล็อตจะมีผลิตภัณฑ์แผนวงจรรวมมากมาย เมื่อได้รับการทดสอบทางไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว พบว่าส่วนมากล็อตที่นำเข้ามาในกระบวนการจะถูกกักไว้เพื่อรอวิศวกรทดสอบมาทำการตรวจสอบปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหา เนื่องจากวิศวกรทดสอบจะต้องรอเอกสารที่ระบุปัญหาของล็อตงานนั้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ ส่งผลให้ล็อตงานถูกกักอยู่ที่กระบวนการทดสอบเพื่อรอการตัดสินใจจากวิศวกรทดสอบ จึงเกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและอาจจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

ดังนั้น ผู้ทำการค้นคว้าจึงเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการเสียเวลาการกักผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการส่งมอบเอกสารไปยังส่วนต่างๆ ในฝ่ายทดสอบทางไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบแผนวงจรรวมเพื่อลดอัตราการกักผลิตภัณฑ์ของส่วนเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งมอบไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับแผงวงจรรวมบนเฟรม และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการและวิศวกรทดสอบ

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

เนื่องจากหน่วยงานการทดสอบแผงวงจรรวมเป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่ทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของแผงวงจรรวมทุกชนิด ดังนั้น การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบแผงวงจรรวมมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้

1. เพื่อให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ของแผนกทดสอบแผงวงจรรวมรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อควบคุมและติดตามผลการตัดสินใจของสื่อตงานหลังการทดสอบแผงวงจรรวม
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับบันทึกรายละเอียดปัญหาลงบนกระดาษหลังการทดสอบทางไฟฟ้า

1.3 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ

ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมนั้น นำโปรแกรมประยุกต์เว็บมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบทางไฟฟ้าของวงจรรวมซึ่งติดต่อกับผู้ใช้งานจากหลายฝ่าย เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานดูแลและจัดการงานที่กักไว้ และวิศวกรทดสอบ เป็นต้น โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1. การระบุสิทธิ์ของผู้ใช้งานสำหรับการสร้าง แก้ไข แบบฟอร์มได้
2. การเรียกใช้งานเอาต์พุตจากระบบอื่นเพื่อนำมาเป็นอินพุตของระบบ
3. การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและการค้นคืนประวัติข้อมูลจากฐานข้อมูล
4. การส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้
5. เครื่องทดสอบและเครื่องกำเนิดเฟรมของบริษัท เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด มีหลายประเภท ดังนั้นข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาระบบมาจากส่วนการทดสอบทางไฟฟ้าของเครื่องทดสอบแผงวงจรรวมและเครื่องกำเนิดเฟรมเพียงประเภทเดียว
6. ข้อมูลผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมเป็นเพียงบางส่วนและเป็นชื่อสมมุติ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

กระบวนการพัฒนาระบบสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ศึกษาข้อกำหนด หลักการ ระบบการทำงานที่หน่วยงานมีความต้องการ รวมทั้งบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดและปัญหาที่มีอยู่ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในระบบงานปัจจุบัน
2. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ระบบ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ซึ่งจะใช้ยูเอ็มแอลจำลองการทำงานของระบบ
4. ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์เว็บ และสามารถบันทึกรายงานไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิง ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล MS SQL Server 2008 และ โปรแกรม Visual Studio 2010
5. พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้
6. ทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด สรุปผลการศึกษาโครงการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบแผงวงจรรวม ช่วยสนับสนุนการทำงานได้ ดังนี้

1. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับบันทึกรายละเอียดปัญหาลงบนกระดาษหลังการทดสอบทางไฟฟ้า
2. ไม่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่สำหรับเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งมีระยะเวลาจำกัดในการเก็บรักษา
3. เพิ่มระยะเวลานำ (Lead Time) สำหรับระยะเวลาในการส่งมอบให้สูงขึ้น ซึ่งทำให้การส่งมอบลูกค้าทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
4. สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ

หัวข้อนี้กล่าวถึงทฤษฎีเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย วงจรการพัฒนา ระบบ และระบบฐานข้อมูล

2.1 วงจรการพัฒนา

การพัฒนาระบบงานด้วยวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นลำดับ 5 ขั้นตอน (ปรัชญา ศิริภูรี, 2556) คือ

1. การวางแผนระบบ เป็นขั้นตอนในการกำหนดปัญหาหรือขอบเขตของโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผนระบบดังนี้

- 1) สำรวจความต้องการของระบบ จะทำตั้งแต่เริ่มกระบวนการ และอธิบายความต้องการ สิ่งเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ปรับปรุงใหม่
- 2) ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น โดยความต้องการของระบบอาจได้มาจากการสัมภาษณ์ พูดคุย แบบสอบถาม เป็นต้น
- 3) วางแผนระบบ โดยนำสิ่งที่รวบรวมได้มารวมกัน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

2. การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของโครงการ สนับสนุนความต้องการของธุรกิจและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาระบบ โดยมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ คือ

- 1) หาความต้องการของระบบ เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อใช้อธิบายระบบปัจจุบันและความต้องการของระบบใหม่
- 2) การสร้างแบบจำลอง ซึ่งเป็นการนำความต้องการที่ได้มาสร้างแบบจำลอง
- 3) กำหนดแผนงานในการพัฒนา เป็นการเลือกวิธีสร้างระบบว่าจะซื้อหรือพัฒนาเอง หลังจากที่ทราบความต้องการและแบบจำลองที่ชัดเจนแล้ว

3. การออกแบบระบบ เป็นการปฏิบัติตามความต้องการในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ โดยเปลี่ยนจากแบบจำลองเชิงแนวคิด เป็นแบบจำลองการทำให้เกิดผล กิจกรรมในขั้นตอนนี้ คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบการเขียนโปรแกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. การพัฒนาระบบ เป็นขั้นตอนการสร้างระบบสารสนเทศ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - 1) การจัดการการเขียน โปรแกรม ควรมีการติดตามผลและประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ผู้ได้รับมอบหมายงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบ
 - 2) การทดสอบระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดให้มากที่สุด โดยมีการทดสอบ 4 ช่วงเวลา คือ การทดสอบแต่ละหน่วยการทำงาน การทดสอบเมื่อรวมหน่วย การทดสอบหลังจากรวมทุก ๆ หน่วยการทำงาน และทำการทดสอบทั้งระบบว่าสามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการอย่างถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่
 - 3) การจัดทำเอกสาร จะต้องเตรียมเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของโปรแกรม เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เอกสารการทำงานของระบบ และเอกสารสำหรับผู้ไ้
 - 4) การแปลงระบบ คือ การแปลงการทำงานจากระบบเดิมให้เป็นระบบใหม่
 - 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดการเพื่อให้ผู้ใช้ยอมรับและสามารถใช้งานระบบใหม่ได้
5. การดำเนินการและสนับสนุน เป็นขั้นตอนหลังจากการทำกิจกรรมในการสร้างระบบใหม่แล้ว ซึ่งต้องมีการเตรียมระบบความช่วยเหลือ การบำรุงรักษาระบบ และการประเมินระบบ

2.2 ระบบฐานข้อมูล

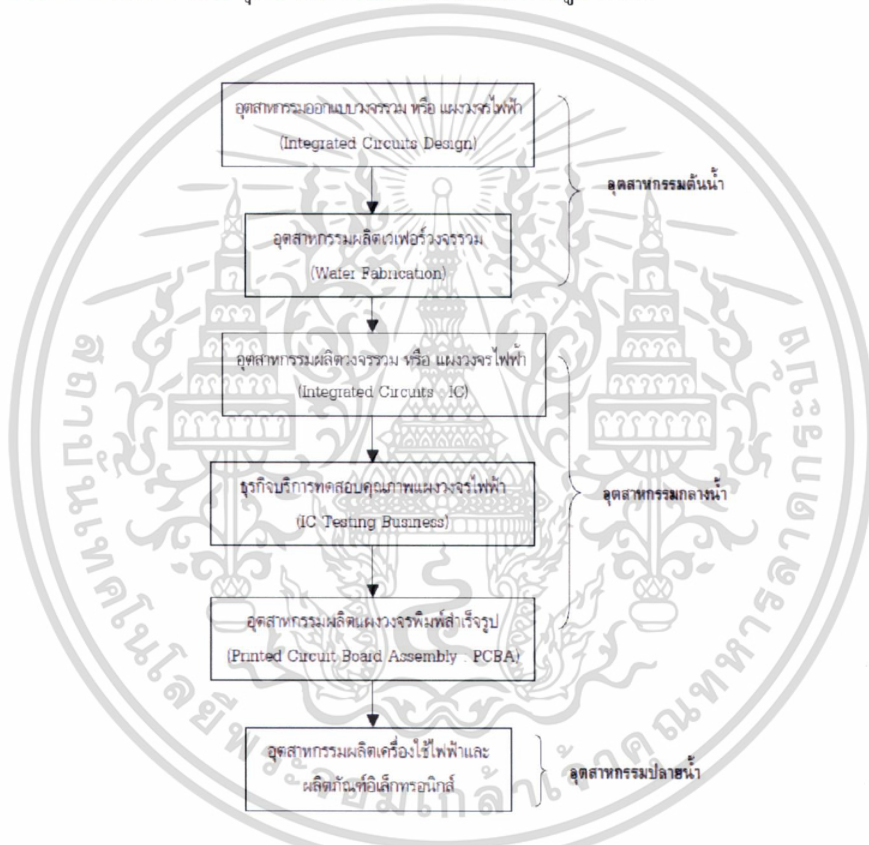
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล (ณัฐพล คล้ายชม. 2556)

บทที่ 3

การทำงานของระบบปัจจุบัน

3.1 ธุรกิจการผลิตแผงวงจรรวม

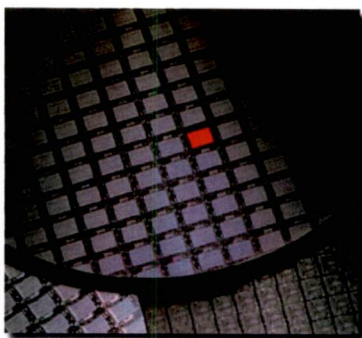
โครงสร้างของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรรวมแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ อุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรมกลางน้ำ และอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งแต่ละส่วนอุตสาหกรรมจะประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรรวม

อุตสาหกรรมต้นน้ำ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมออกแบบวงจรเพื่อให้แผงวงจรรวมสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ และอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอร์ที่นำวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมาผลิตเป็นแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งมีชิปอยู่หลายร้อยชิ้นและเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแผงวงจรรวม ดังรูปที่ 3.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2 แผ่นเวเฟอร์

อุตสาหกรรมกลางน้ำ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรรวม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำชิปที่อยู่บนแผ่นเวเฟอร์มาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวม ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวม

อุตสาหกรรมปลายน้ำ เป็นอุตสาหกรรมที่นำแผงวงจรรวมมาประกอบรวมกันบนแผงจอร์มิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

บริษัท เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผงจอร์มิมพ์อุตสาหกรรมกลางน้ำ โดยมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งการผลิตที่อยู่ในประเทศไทยนั้นจะเป็นการนำเข้าแผ่นเวเฟอร์จากบริษัทแม่มาประกอบเป็นแผงวงจรรวมแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า

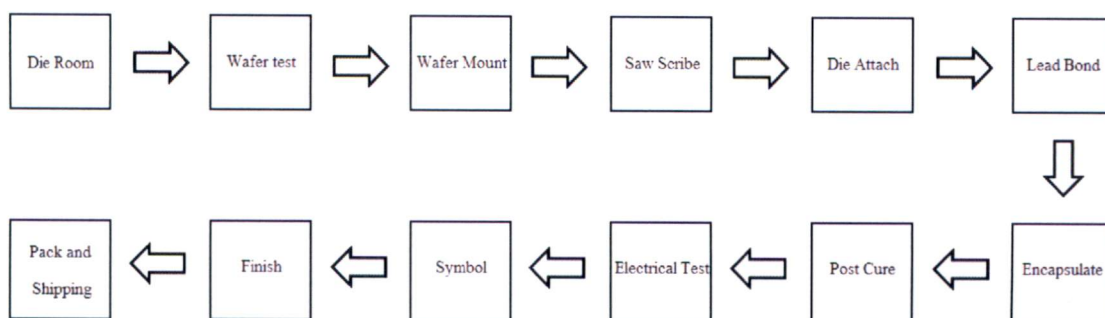
กระบวนการผลิตแผงวงจรรวมประกอบด้วยหลายกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และรายละเอียดของแต่ละกระบวนการอธิบายได้ ดังนี้

1. Die Room แผนกที่ทำการเก็บแผ่นเวเฟอร์ที่ได้รับมาจากบริษัทแม่
2. Wafer Test เป็นกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าของแผงวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์
3. Wafer Mount เป็นกระบวนการติดแผ่นพลาสติกที่หลังแผ่นเวเฟอร์
4. Saw Scribe เป็นกระบวนการตัดแยกแผงวงจรรวมออกเป็นตัวๆ บนแผ่นเวเฟอร์
5. Die Attach เป็นกระบวนการนำแผงวงจรรวมแต่ละตัวมาประกอบติดกับแผ่นทองแดง

ที่เรียกว่า เฟรม โดยใช้กาวชนิดพิเศษที่เรียกว่า Epoxy glue ในการยึดติด

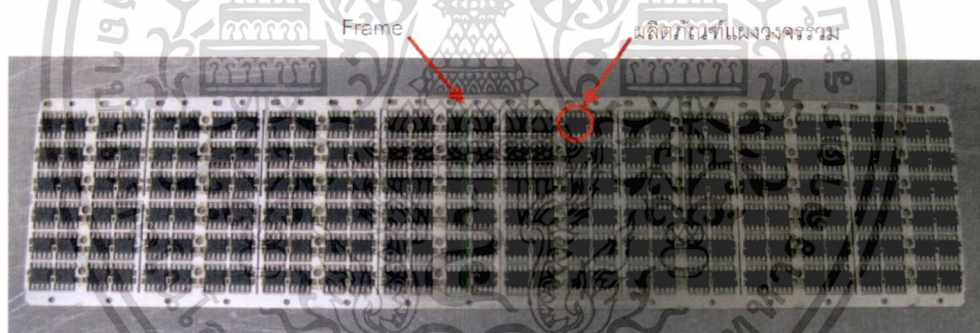
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ในพ็อกเก็ตบุ๊กเท่านั้น มิใช่ข้อมูลให้หันไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 กระบวนการผลิตแผงวงจรรวม

6. Lead Bond เป็นกระบวนการเชื่อมวงจระหว่างแผงวงจรรวมกับขาของเฟรมด้วยลวดทองคำ
7. Encapsulate เป็นกระบวนการปิดผนึกแผงวงจรรวมแต่ละตัว โดยใช้กาว (Epoxy) ชนิดแข็ง
8. Post Cure เป็นกระบวนการอบในตู้อบเพื่อให้เกิดการหลอมวัสดุที่ปิดผนึกและแข็งตัวของในอุณหภูมิที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะ ได้ผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 เฟรมและผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมหลังกระบวนการ Post Cure

9. Electrical Test เป็นขั้นตอนการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและฟังก์ชันการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
10. Symbol เป็นกระบวนการประทับตราสัญลักษณ์ทางการค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์ และเดือนปีที่ผลิตบนตัวแผงวงจรรวมโดยใช้แสงเลเซอร์
11. Finish เป็นกระบวนการตัดขาให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้งานและตัดขาเพื่อแยกแผงวงจรรวมออกเป็นตัวงาน และคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบออกจากล็อตการผลิต
12. Pack and Shipping เป็นกระบวนการบรรจุแผงวงจรรวมให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากกระบวนการผลิตแผงวงจรรวมดังกล่าวข้างต้น ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมจะเน้นเฉพาะส่วนงานการทดสอบทางไฟฟ้า ดังจะกล่าวในหัวข้อ 3.2

3.2 ขั้นตอนการทำงานในระบบปัจจุบัน

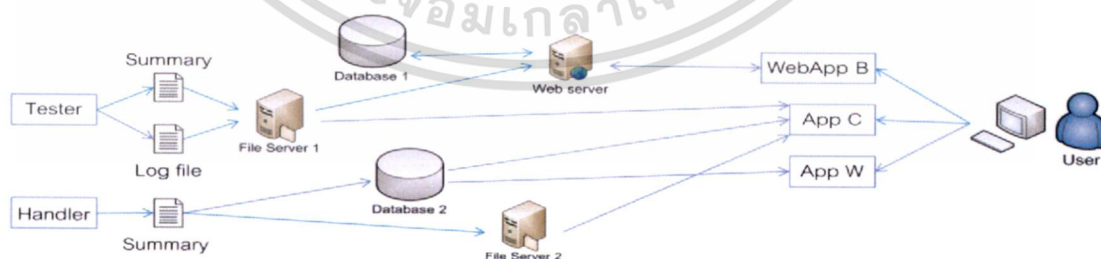
ในปัจจุบันส่วนทดสอบทางไฟฟ้ามีกระบวนการทำงาน 5 กระบวนการ ดังนี้

1. ตรวจสอบจำนวนงานก่อนทำการทดสอบ

เมื่อฝ่ายทดสอบทางไฟฟ้าได้รับลีสต์งานที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมจำนวนหลายๆ เฟรม พนักงานระดับปฏิบัติการจะตรวจสอบจำนวนผลิตภัณฑ์จริงกับจำนวนที่มีอยู่ในระบบ หากมีจำนวนตรงกันจึงจะสามารถนำเข้าทดสอบทางไฟฟ้าได้ แต่ถ้าจำนวนผลิตภัณฑ์จริงและในระบบไม่ตรงกันจะไม่สามารถนำเข้าทดสอบทางไฟฟ้าได้ ซึ่งพนักงานต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบเพื่อติดต่อแก้ไขกับแผนกก่อนหน้าต่อไป

2. ทดสอบแผงวงจรรวม

พนักงานระดับปฏิบัติการนำลีสต์งานเข้าสู่เครื่องลำเลียงเฟรม จากนั้นเครื่องจะลำเลียงเฟรมจะลำเลียงแผงวงจรรวมทีละเฟรมไปยังบริเวณส่วนทดสอบของเครื่องทดสอบและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าจากซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์แผงวงจรรวมนั้นๆ จากนั้นจะเคลื่อนเฟรมแผงวงจรรวมออกจากบริเวณทดสอบของเครื่องทดสอบ ซึ่งเฟรมที่ทดสอบแล้วจะถูกลำเลียงไปเรียงและจัดเก็บอีกด้านหนึ่งของเครื่องลำเลียงเฟรมหลังจากที่ลีสต์งานถูกทดสอบครบทุกเฟรม เมื่อสิ้นสุดการทดสอบเครื่องทดสอบและเครื่องลำเลียงเฟรมจะสร้างไฟล์ข้อมูลดิบทั้ง Log File และ Summary ออกมาดังแสดงในรูป 3.6



รูปที่ 3.6 สภาพแวดล้อมการทำงานของระบบการทดสอบแผงวงจรรวม

จากแผนภาพสภาพแวดล้อมการทำงานของระบบการทดสอบแผงวงจรรวม ดังรูปที่ 3.6

ไฟล์ข้อมูลดิบจากเครื่องทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย Summary และ Log File โดยจะถูกอัพโหลดเข้าเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่งงานให้ทีมบริหารเชิงนโยบายการทดสอบ และข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเพิ่ม 1 (File Server 1) ส่วนไฟล์ข้อมูลดิบของเครื่องลำเลียงเฟรมซึ่งมีเพียง Summary เท่านั้น จะถูกอัปโหลดเข้าไปในฐานข้อมูล 2 (Database 2) และ เครื่องบริการเพิ่ม 2 (File Server 2) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการตัดสินใจล็อตงาน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 3

3. การตัดสินใจล็อตงาน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้

1) พนักงานระดับปฏิบัติการตรวจสอบผลการทดสอบว่ามีอัตราผลิตภัณฑ์เสีย พารามิเตอร์หมวดใดเกินค่าพารามิเตอร์ลิมิตที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล 1 หรือไม่จากหน้าเว็บเพจของระบบโปรแกรมประยุกต์เว็บปี (Web Application B) ดังแสดงในรูปที่ 3.7 โดยระบุล็อตงานที่ต้องการตรวจสอบในช่อง “Lot ID” หากล็อตงานมีค่าพารามิเตอร์ลิมิตเกินที่กำหนดไว้โปรแกรมจะแสดงผลว่าล็อตงานไม่สามารถส่งต่อยังกระบวนการถัดไปได้ ดังรูปที่ 3.8 แต่หากล็อตงานมีค่าพารามิเตอร์ไม่ลิมิตเกินที่กำหนดไว้โปรแกรมจะแสดงผลว่าล็อตงานสามารถส่งต่อยังกระบวนการถัดไปได้ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.7 หน้าเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์เว็บปี

Instruction (อ่านคำแนะนำ)	Bin13>0.1% (Leakge tests) : Hold lot wait for Engineer
------------------------------	--

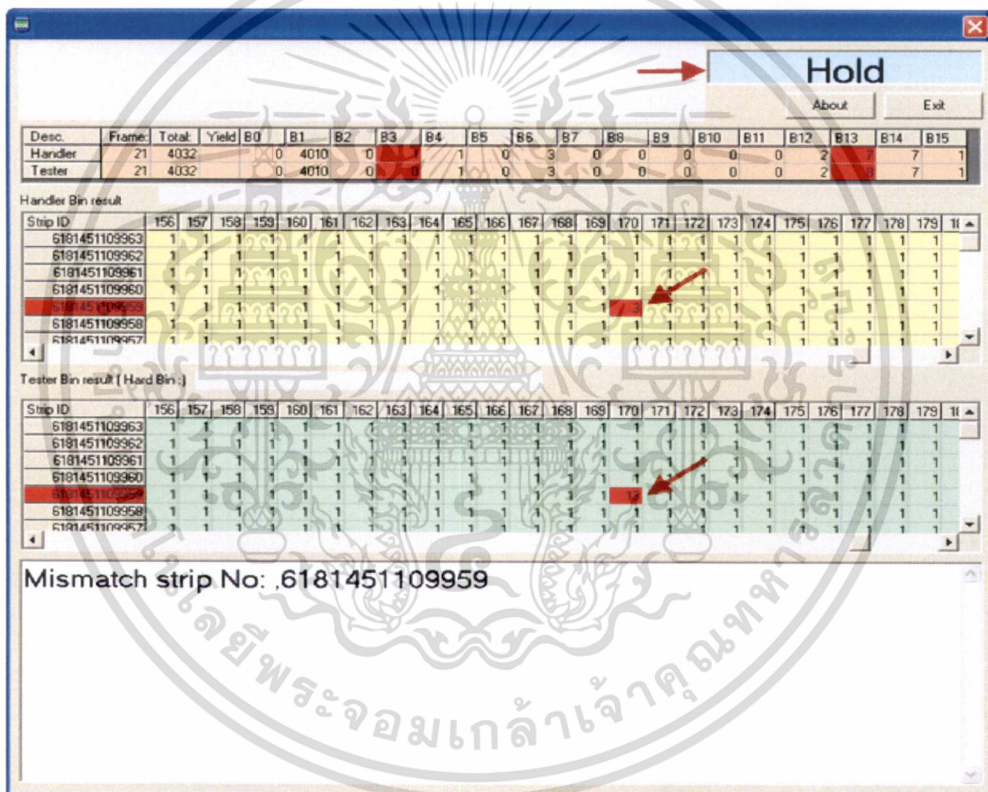
รูปที่ 3.8 โปรแกรมประยุกต์เว็บปีในกรณีล็อตงานถูกกักไว้



รูปที่ 3.9 โปรแกรมประยุกต์เว็บปีในกรณีล็อตสามารถถูกปล่อยไปยังกระบวนการถัดไปได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

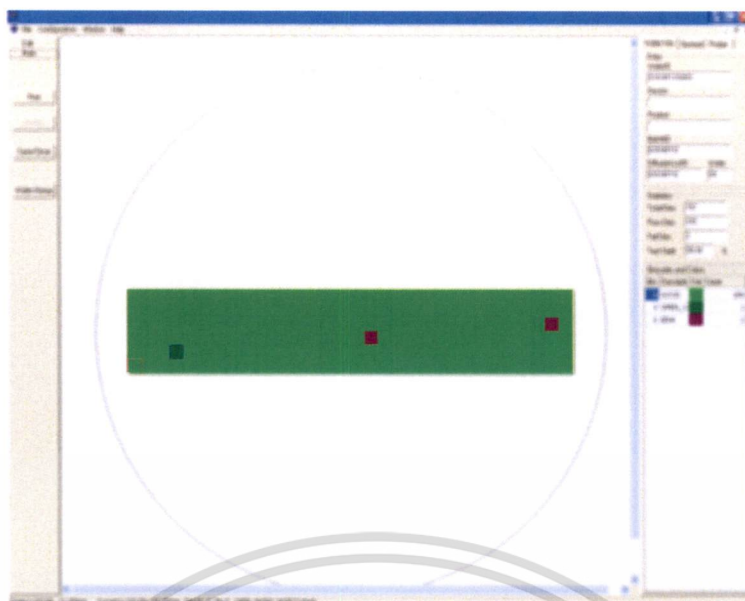
2) พนักงานระดับปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการทดสอบของแผงวงจรรวมแต่ละตัวจากเครื่องทดสอบและเครื่องลำเลียงเฟรมโดยใช้โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ (Window Application C) ซึ่งระบบจะทำการค้นหาข้อมูลผลการทดสอบของลือตงานจากเครื่องบริการเพิ่ม 1 ฐานข้อมูล 2 และเครื่องบริการเพิ่ม 2 และผลการทดสอบจากทั้งสองแหล่งข้อมูลจะต้องมีผลที่เหมือนกันทุกตำแหน่งบนเฟรม (Strip ID) หากผลการทดสอบของเครื่องลำเลียงเฟรมที่บรรจุไว้ในเครื่องบริการเพิ่ม 2 และผลการทดสอบของเครื่องทดสอบที่บรรจุไว้ในเครื่องบริการเพิ่ม 1 มีผลลัพธ์ที่ต่างกัน โปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ์สีแดงตรงตำแหน่งนั้นและแสดงผลข้อความว่า “Hold” และรายละเอียดต่างๆ ดังรูปที่ 3.10 ทำให้ลือตงานไม่สามารถส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไปได้เช่นกัน



รูปที่ 3.10 หน้าต่างแสดงผลพีโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์

3) พนักงานระดับปฏิบัติการแสดงตำแหน่งผิดปกติของตำแหน่งบนเฟรมของแผงวงจรรวมจากผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ดับเบิลยู (Window Application W) ดังแสดงในรูปที่ 3.11 เพื่อรายงานให้วิศวกรทดสอบทราบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.11 หน้าต่างแสดงผลพัทธ์ของโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ดับเบิลยู

4. บันทึกผลการทดสอบ

เมื่อพนักงานระดับปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลผลการทดสอบจากทั้ง 3 โปรแกรมเสร็จแล้ว หากผ่านทั้งหมดคืองานนั้นก็สามารถถูกเคลื่อนย้ายไปยังกระบวนการผลิตขั้นต่อไปได้ แต่ถ้ามีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งพบปัญหา พนักงานระดับปฏิบัติการจะต้องกักถืองานนั้นเอาไว้ที่ส่วนทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อรอวิศวกรทดสอบมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา จากกรณีที่ถืองานถูกกัก พนักงานระดับปฏิบัติการจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดการทดสอบทั้งหมดลงในแบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบแผนวงจรรวมซึ่งเรียกว่า PPO (Product Problem Form) ดังรูปที่ 3.12 โดยมีรายละเอียด 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1) รายละเอียดและผลของการทดสอบแผนวงจรรวม เพื่อบอกรายละเอียดทั้งหมดของถืองานเมื่อเข้าทดสอบทางไฟฟ้า ได้แก่

- **DATE ON HOLD** จะระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการทดสอบ
- **OPR NO.** หมายเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทดสอบ เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการหมายเลขประจำตัว 15967 เป็นต้น
- **SHIFT** จะระบุว่าพนักงานระดับปฏิบัติการผู้ทดสอบคนนั้นทำงานกะใด กล่าวคือ กะเช้า (D) กะบ่าย (M) หรือ กะดึก (N)
- **PART TYPE** จะชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ
- **LOT ID** เป็นตัวเลขที่ระบุตัวตนของผลิตภัณฑ์ในระบบ โดยจะมีค่าไม่ซ้ำกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

■ PKG คือ แพ้ประเภทของแผงวงจรรวม

MANUFACTURING THAILAND	PRODUCT PROBLEM FORM	FORM : B		
DATE ON HOLD : <u>11 Feb 2014</u> SHIFT <input checked="" type="checkbox"/> D () M () N OPR. NO. : <u>2129A</u> FLOW TYPE: _____ PART TYPE : <u>11A09171/b</u> PKG <u>2129A</u> REV. _____ SPC _____ LOT ID. : <u>11E51A30</u> FAB NBR <u>007371</u> QTY. IN : <u>5436</u> BIN 1 _____ BIN 2 _____ BIN 3 _____ REJECT OUT : <u>5965</u> PARA <input checked="" type="checkbox"/> FUNC () CONT <input checked="" type="checkbox"/> AC () REJ. : <u>18</u> <u>9%</u> <u>1</u> <u>6</u> FINAL YLD : <u>98.817</u> <u>Handled</u>				
FIRST OUT : <u>2129A-1</u> 1st RETEST IN : <u>AAA</u> 2nd RETEST IN : _____ FUNC. PARA REJ : _____ 1st RETEST OUT : <u>100%</u> 2nd RETEST OUT : _____				
ACT. YLD : _____ (%) ACT. PDA : _____ (%) STD. YLD. : <u>99.6</u> (%) STD. PDA : _____ (%) TEMP. TEST : <u>ROOM 13.5</u> C () HOT _____ C () COLD _____ C TEST PROGRAM : <u>11A09171 AP00001</u> BOARD NO. : <u>01</u> TESTER TYPE : <u>Step 17</u> SYS/ST. NO. : <u>122</u> HANDLER TYPE : <u>11E51A30</u> HANDLER NO. : <u>43</u>				
PROBLEM EVALUATION RESULTS : <u>Hold Wait for Eng</u>				
VERIFY OR AUTHORIZE ON HOLD BY : <u>[Signature]</u> DATE <u>11 Feb 2014</u>				
RESOLUTION : <u>for bin 207 2 ca.</u> <u>- Verify OIS. not pass, bring y.m. in 12 z complete return AM</u>				
VERIFY OR AUTHORIZE OFF HOLD BY : _____ DATE ____/____/____				
INVENTORY CONTROL	INV. POINT	HOLD CODE	DATE	BY
ON HOLD	OPL	APE ADD OPL	10-Feb-2014 11-Feb-2014	16-238 -19138
OFF HOLD			12-Feb-2014	

รูปที่ 3.12 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการทดสอบ

■ QTY แบ่งออกได้ดังนี้ คือ

- IN คือ จำนวนงานที่นำเข้าทดสอบ
- OUT คือ จำนวนงานที่ได้จากการทดสอบสุทธิ
- REJ คือ จำนวนงานเสียที่ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้า
- BIN 1 คือ จำนวนงานที่ได้จากการทดสอบสุทธิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- **BIN 2** คือ จำนวนงานเสียเพื่อวัตถุประสงค์ของวิศวกรทดสอบเท่านั้น
- **BIN 3** คือ จำนวนงานเสียที่ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้าแบบสุ่ม
- **REJ** คือ จำนวนงานเสียจากการทดสอบทางไฟฟ้าแบ่งออกได้ ดังนี้
 - **PARA** และ **FUNC** คือ จำนวนงานเสียจากพารามิเตอร์ต่างๆ ของการทดสอบ
 - **CONT** คือ จำนวนงานเสียจากในกระบวนการผลิตแผงวงจรรวม
 - **AC** คือ จำนวนงานเสียอื่น ๆ
- **FIRST OUT** คือ จำนวนงานดีที่ผ่านการทดสอบ
- **FUNC PARA REJ** คือ จำนวนงานเสียทั้งหมดที่จะต้องนำมาทดสอบอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเป็นงานเสียจริง ๆ
- **1st RETEST IN** มีค่าเท่ากับ FUNC PARA REJ
- **1st RETEST OUT** คือ จำนวนงานดีหลังจากการทดสอบเพื่อยืนยัน (Retest) ครั้งที่ 1
- **2nd RETEST IN** คือ จำนวนงานเสียที่เหลือหลังจากการทดสอบเพื่อยืนยัน ครั้งที่ 1
- **2nd RETEST OUT** คือ จำนวนงานดีหลังจากการทดสอบเพื่อยืนยันครั้งที่ 2
- **ACT YLD** เป็นร้อยละความสัมพันธ์ระหว่าง IN และ OUT
- **STD YLD** เป็นร้อยละมาตรฐานที่วิศวกรทดสอบระบุไว้แต่ละผลิตภัณฑ์
- **TEMP TEST** เป็นอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์
 - **ROOM** มีค่าไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
 - **HOT** มีค่ามากกว่า 125 องศาเซลเซียส
 - **COLD** มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส
- **TEST PROGRAM** คือ ซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงวงจรรวมแต่ละชนิด
- **BOARD NO.** คือ หมายเลขบอร์ดทดสอบสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงวงจรรวมแต่ละชนิด
- **TESTER TYPE** คือ ชนิดของเครื่องทดสอบขึ้นอยู่กับแผงวงจรรวมแต่ละชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- **SYS/ST NO.** คือ หมายเลขเครื่องทดสอบ
- **HANDLER TYPE** คือ ชนิดของเครื่องลำเลียงเฟรม
- **HANDLER NO.** คือ หมายเลขของเครื่องลำเลียงเฟรม

2) ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ เมื่อลือตงานนั้นก็สามารถถูกเคลื่อนย้ายไปยังกระบวนการผลิตขั้นต่อไปได้ พนักงานระดับปฏิบัติการจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงในพื้นที่ด้านล่าง ได้แก่

- **PROBLEM EVALUATION RESULTS** โดยพนักงานฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้กรอกรายละเอียดของปัญหาต่างๆ ระหว่างการทดสอบ
- **VERIFY OF AUTHORIZE ON HOLD BY** เป็นการระบุชื่อว่าเป็นผู้เขียนรายละเอียด
- **RESOLUTION** วิศวกรทดสอบจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยกรอกรายละเอียดคำสั่งลงในช่องนี้

3) สถานะของงาน ได้แก่

- **ON HOLD** จะบอกสถานะของว่าลือตงานถูกกักไว้ที่ใด
- **OFF HOLD** จะบอกสถานะว่าลือตงานจะถูกส่งไปยังสถานะใดต่อไป

5. วิเคราะห์และตัดสินใจลือตงานที่กักไว้

วิศวกรทดสอบมีหน้าที่รับแบบบันทึกการทดสอบแผนผังวงจรรวมของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบจากหัวหน้าพนักงานระดับปฏิบัติการและนำไปวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและส่งมอบไปยังหน่วยงานถัดไป

3.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน

1. การส่งต่อข้อมูลและแบบฟอร์ม

เมื่อลือตงานถูกกักไว้ พนักงานระดับปฏิบัติการจะต้องเขียนแบบบันทึกผลการทดสอบขึ้น ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบของกระดาษ จากนั้นพนักงานระดับปฏิบัติการจะนำแบบมารวบรวมไว้ที่หัวหน้างานและนำส่งเพื่อให้วิศวกรทดสอบตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้วิศวกรทดสอบจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตัดสินใจงานลือตนั้นๆ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งแบบฟอร์มและยังทำให้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สับสนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กระบวนการส่งมอบงานไปยังกระบวนการถัดไปล่าช้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากมีการสื่อสารกันทางอีเมลให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยสื่อตงานจึงเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. การค้นหาข้อมูล

เมื่อสื่อตงานส่งไปยังลูกค้าเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถนำแฟงวงจรรวมนั้นไปใช้งานกับแอปพลิเคชันของตนได้ จะมีการร้องเรียนมาทางบริษัทเพื่อสอบถามข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งหรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากแผนกต่างๆ ภายในบริษัทเองก็ตาม ดังนั้น ทางฝ่ายผลิตและวิศวกรทดสอบจะต้องค้นหาข้อมูลการทดสอบจากแบบบันทึกการทดสอบของสื่อตงานดังกล่าว ซึ่งใช้เวลานานเนื่องจากจัดเก็บเอกสารไว้เป็นจำนวนมากและไม่เป็นหมวดหมู่

3. การกรอกและแก้ไขข้อมูล

หากพนักงานลงรายละเอียดในแบบบันทึกผลการทดสอบผิดพลาดไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน จึงทำให้วิศวกรทดสอบเสียเวลาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจกับสื่อตงานที่ถูกกักไว้โดยไม่จำเป็น

3.4 แนวทางการแก้ไข

จากปัญหาเรื่องการส่งต่อข้อมูลและแบบบันทึกบันทึกผลการทดสอบ กระบวนการสืบค้นหาข้อมูลการทดสอบย้อนหลังที่ยังคงใช้กระดาษสำหรับบันทึก การกรอกและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดล้วนแต่เป็นปัญหารายวันที่เกิดขึ้นที่แผนกทดสอบแฟงวงจรรวม ดังนั้นจากความสำคัญดังกล่าว ผู้ค้นคว้าจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการทดสอบเป็นต้นแบบ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ วิศวกรทดสอบ ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันพนักงานใส่ข้อมูลลงในเอกสารผิดพลาดซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์ปัญหาของวิศวกรทดสอบ

บทที่ 4

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่

4.1 การทำงานของระบบใหม่

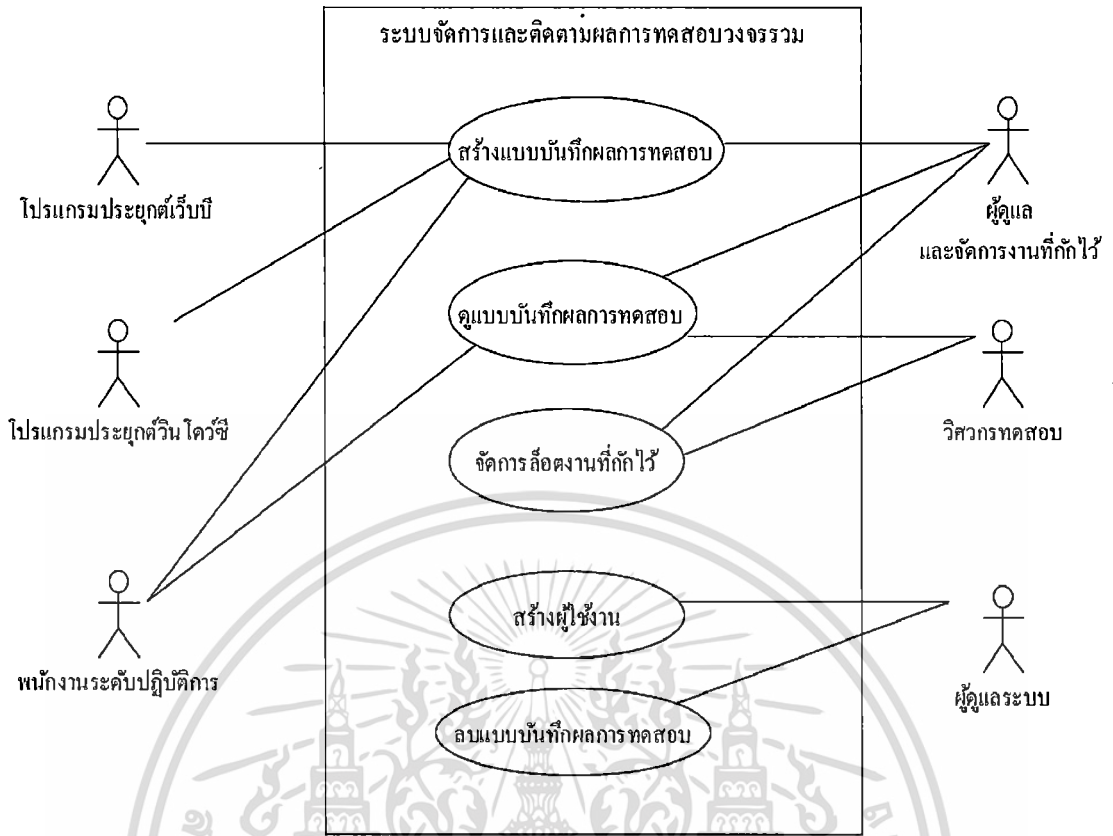
จากการศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบันพบว่ามีความล่าช้าหลายกระบวนการ กล่าวคือ การส่งต่อข้อมูลและแบบฟอร์ม กระบวนการสืบค้นหาข้อมูลการทดสอบย้อนหลัง การแก้ไขข้อมูล ดังนั้น สำหรับระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจะต้องสามารถรองรับการทำงานในระบบปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม พัฒนาเป็น โปรแกรมประยุกต์เว็บ เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นแบบบันทึกผลการทดสอบได้ทุกสื่อ แต่หากต้องการแก้ไข สร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ หรือบันทึกข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมในระบบ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบ จึงจะสามารถใช้งานได้

4.2 การวิเคราะห์และออกแบบตามแนวคิดเชิงวัตถุ

จากผลการศึกษาการทำงานของระบบปัจจุบันและความต้องการของระบบใหม่ ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม อาศัยหลักแนวคิดเชิงวัตถุด้วยยูมแอล ตามแผนภาพยูสเคสของระบบใหม่จากรูปที่ 4.1 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบ และประกอบด้วย 6 แอ็กเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์เว็บปี โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ซี พนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้ และวิศวกรทดสอบ โดยมี 5 ยูสเคสที่เป็นการทำงานหลักของระบบ ซึ่งอธิบายดังต่อไปนี้

139274



รูปที่ 4.1 แผนภาพยูสเคสของระบบใหม่

1. สร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ เมื่อพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับแจ้งว่าไม่สามารถปล่อยลีตงานได้และรอการตรวจสอบจากวิศวกรทดสอบหน้างาน พนักงานระดับปฏิบัติการหรือผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้จะสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบเพื่อขอให้วิศวกรทดสอบทราบและตัดสินใจต่อไป โดยมีรายละเอียดคำอธิบายยูสเคสตามตารางที่ 4.1 และเอกทิวติโคอะแกรมของยูสเคสสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบดังรูปที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 คำอธิบายยูสเคสสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ

Use Case No.	01
Use Case Name	สร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ
Description	เมื่อพนักงานระดับปฏิบัติการหรือผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้ได้รับคำแนะนำการกักลีตงานจาก <ol style="list-style-type: none"> 1. โปรแกรมประยุกต์เว็บปี โดยที่จะแสดงผลการตรวจสอบที่ได้จาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Error! Reference source not found.

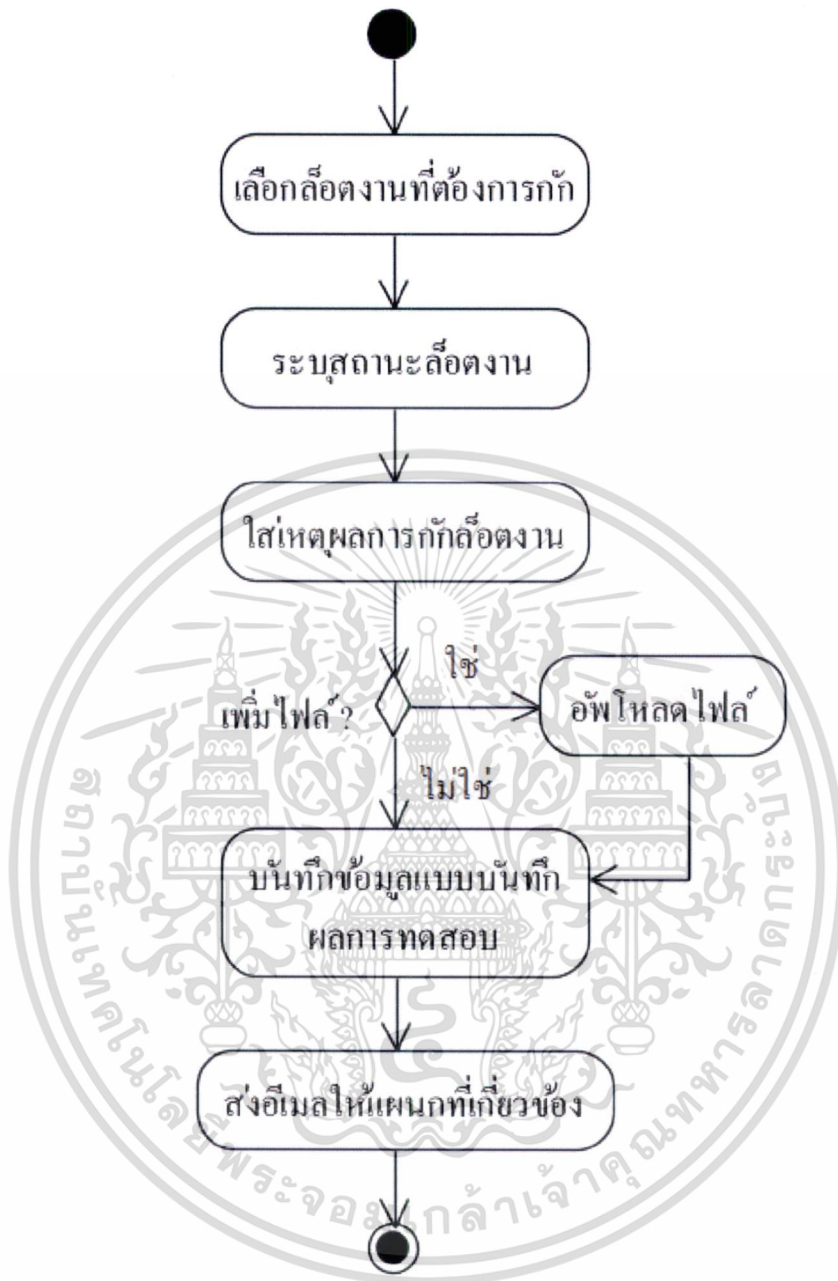
Description	<p>เครื่องบริการเพิ่ม 1 และทำให้งานไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังกระบวนการถัดไปได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล 1</p> <p>2. โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ โดยที่จะแสดงผลการทดสอบที่ได้จากเครื่องบริการเพิ่ม 2 และทำให้งานไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังกระบวนการถัดไปได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล 2</p> <p>ดังนั้นจึงเข้าสู่ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมเพื่อแจ้งบอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหาวิธีจัดการกับงานที่ได้รับการกักไว้</p>
Primary Actor	<p>โปรแกรมประยุกต์เว็บปี, โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์, พนักงานระดับปฏิบัติการ, ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้</p>
Pre-Condition	<p>ผลการตรวจสอบของโปรแกรมประยุกต์เว็บปี, โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์</p>
Post-Condition	<p>แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นเพียงสร้างใหม่</p>
Basic Flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบสร้างแบบบันทึกการทดสอบให้มี Revision แรกเป็น 1 2. ระบบกำหนดค่าสถานะของแบบบันทึกผลการทดสอบเป็นสถานะเพียงสร้างใหม่ 3. ระบบสร้าง Hold_ID, Create_Date, Update_Date, Create_User และ Update_User ขึ้นโดยใช้วันเดือนปี และเวลาปัจจุบัน 4. ระบบแสดงรายการ Lot_ID โดยแสดงผลให้เลือกเฉพาะล็อตงานที่ไม่ผ่านข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์เว็บปีและโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ 5. ผู้ใช้เลือก Lot_ID จากรายการที่แสดงไว้ในดังรูปที่ 4.3 หน้าจอสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบใหม่เมื่อพนักงานเลือกล็อต 6. ระบบแสดงข้อมูลเฉพาะของล็อตงาน ได้แก่ Batch_ID, BL_Name, Product, FAB_Name, Tester, Handler, LoadBoard, IN, OUT 7. ระบบคำนวณพร้อมกับแสดงผล Rej และ YIELD ของล็อตงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

<p>Basic Flows</p>	<p>8. ระบบนำผลการตรวจสอบลือตงานจาก โปรแกรมประยุกต์เว็บปี, โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์มาระบุลงในช่อง Comments เพื่อแจ้งให้วิศวกรทดสอบทราบเหตุผลการกักลือตงาน</p> <p>9. ผู้ใช้งานเพิ่มไฟล์เข้าไปในแบบบันทึกผลการทดสอบ โดยอาจมีมากกว่า 1 ไฟล์</p> <p>10. ระบบจัดเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องบริการเพิ่มและบันทึกลงในฐานข้อมูล</p> <p>11. ผู้ใช้ระบุสถานะต่อไปของลือตงานว่าจะ On Hold, Wait for Engineer, Wait for Retest, Done เป็นต้น</p> <p>12. ผู้ใช้ระบุว่าลือตงานจะถูกส่งถึงแผนกหรือกระบวนการใดถัดไปได้แก่ Engineering, Manufacturing, Quality Control เป็นต้น</p> <p>13. ผู้ใช้ Submit/Send เพื่อยืนยันการส่งต่อลือตงานไปยังกระบวนการถัดไป</p> <p>14. ระบบบันทึกแบบบันทึกผลการทดสอบยังฐานข้อมูล</p> <p>15. ผู้ใช้งานระบุเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากรายการอีเมลเพื่อให้รับทราบและดำเนินการตามที่ระบุไว้</p> <p>16. ผู้ใช้งาน Submit เพื่อยืนยันการส่งอีเมลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว</p> <p>17. ระบบส่งอีเมลแจ้งแบบบันทึกผลการทดสอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังรูปที่ 4.4</p>
<p>Alternative Flows</p>	<p>-</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 แอททิวิตีไดอะแกรมการสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Send Email Form
 User: 240001:Operator [Log Out]

INTEGRATED CIRCUIT TESTING MANAGEMENT AND TRACKING SYSTEM

From: Emmanuel@tmats.com

<input checked="" type="checkbox"/> To All ?	EMAIL	Position	Department
<input checked="" type="checkbox"/>	Bacary@tmats.com	Manager	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Thomas@tmats.com	Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Laurent@tmats.com	Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Mikel@tmats.com	Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Lukas@tmats.com	Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Jack@tmats.com	Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Mesut@tmats.com	Technician	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Olivier@tmats.com	Technician	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Emiliano@tmats.com	Assistant Engineer	Engineering
<input checked="" type="checkbox"/>	Aarons@tmats.com	Assistant Engineer	Engineering

To:

TM@Ts Information				
Revision	Product	Lot	Batch	Instruction
1	TJA1042	NE05ENX0	CDM782	Status: On Hold Comment:BR@T Hold low yield BIN11>0%, BIN13>1%, BIN18>1.5%

รูปที่ 4.4 หน้าจอการส่งอีเมลให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

2. คู่มือฉบับที่ผลการทดสอบ ผู้ใช้ต้องการค้นหาแบบบันทึกผลการทดสอบเพื่อตรวจสอบย้อนหลังหรือต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของล๊อตงานนั้น มีรายละเอียดคำอธิบายยูสเคสตามตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 คำอธิบายยูสเคสคู่มือฉบับที่ผลการทดสอบ

Use Case No.	02
Use Case Name	คู่มือฉบับที่ผลการทดสอบ
Description	เมื่อต้องการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบบันทึกผลการทดสอบสามารถทำได้โดยการระบุได้จาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

Description	<ul style="list-style-type: none"> - วันเดือนปี - ชื่อผลิตภัณฑ์ - รหัสล็อตงาน - สถานะของล็อตงาน - ชื่อธุรกิจผลิตภัณฑ์
Primary Actor	พนักงานระดับปฏิบัติการ, ผู้ดูแลและจัดการล็อตงานที่กักไว้, วิศวกรทดสอบ
Pre-Condition	-
Post-Condition	-
Basic Flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้ค้นหาแบบบันทึกผลการทดสอบจากคำค้นหาได้ตามความต้องการ ได้แก่ From, To, Batch ID, BL, Lot ID, FAB, Product, Status เป็นต้น 2. ระบบแสดงรายการแบบบันทึกผลการทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ใช้งาน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.5 หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกการทดสอบ 3. ผู้ใช้เลือกแบบบันทึกผลการทดสอบที่ต้องการดูรายละเอียด 4. ระบบแสดงรายละเอียดของแบบบันทึกผลการทดสอบที่เลือกไว้ เช่นเดียวกับรูปที่ 4.3
Alternative Flows	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Search Data Form
User: Guest:ViewOnly [Login]

INTEGRATED CIRCUIT TESTING MANAGEMENT AND TRACKING SYSTEM

From: 1-Mar-2014 Batch: Lot ID: Product: Create
To: 25-May-2014 BL: FAB: Status: Search

Revision	Hold_Code	Batch	Lot_id	Products	BL	FAB	Status	CreateDate	CreateUser	UpdateDate	UpdateUser
3	H20140520203225	CDM783	NE05CAX0	TJA1042	AUTO-AMS	ICN8	Release	2014-05-20 20:32:25	110001	2014-05-24 15:52:30	120004
2	H20140523153550	CDR303	NE05ERD0	TJA1042	AUTO-AMS	ICN8	Wait for FA	2014-05-23 15:35:50	250001	2014-05-23 15:40:43	120004
2	H20140318214858	CDR305	NE071800	TJA1041	AUTO-AMS	ICN8	Scrap lot	2014-03-18 21:48:58	1234	2014-05-23 15:27:51	120001
2	H20140523132906	CDM782	NE05ENX0	TJA1042	AUTO-AMS	ICN8	Release	2014-05-23 13:29:06	240001	2014-05-23 15:18:15	130001
1	H20140523131334	CDR389	NE04NY40	TJA1052	AUTO-AMS	ICN8	On Hold	2014-05-23 13:13:34	240001	2014-05-23 13:13:34	240001
2	H20140523120230	CDS052	NE07ES90	TJA1042	AUTO-AMS	ICN8	Done	2014-05-23 12:02:30	240001	2014-05-23 13:10:06	240001
1	H20140523125737	CDS583	NE09DM00	TJA1042	AUTO-AMS	ICN8	On Hold	2014-05-23 12:57:37	240001	2014-05-23 12:57:37	240001
2	H20140520234736	CDM782	NE05ENZ0	TJA1041	AUTO-AMS	ICN8	Wait for Retest	2014-05-20 23:47:36	240001	2014-05-20 23:56:31	240001
6	H20140318215525	CDR305	NE06U050	TJA1041	AUTO-AMS	ICN8	Retest Rejects	2014-03-18 21:55:25	1234	2014-04-02 23:43:45	110001
4	H20140319154400	CDR076	NE06BK20	TJA1041	AUTO-AMS	ICN8	Release	2014-03-19 15:44:00	1234	2014-03-19 16:02:22	111

รูปที่ 4.5 หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกการทดสอบ

3. จัดการล๊อตงานที่กักไว้ เมื่อล๊อตงานได้รับการวิเคราะห์จากวิศวกรทดสอบเรียบร้อยแล้ว ล๊อตงานจะถูกกำหนดสถานะถัดไป จากรายละเอียดคำอธิบายยูสเคสตามตารางที่ 4.3 และแอกทิวิตีไดอะแกรมของยูสเคสจัดการล๊อตงานที่กักไว้ ดังรูปที่ 4.6

ตารางที่ 4.3 คำอธิบายยูสเคสจัดการล๊อตงานที่กักไว้

Use Case No.	03
Use Case Name	จัดการล๊อตงานที่กักไว้
Description	หลังจากค้นหาล๊อตงานนั้นๆ จากหน้าเมนูหลักเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ใช้งานต้องการจัดการกับล๊อตงานล๊อตนั้นๆ โดยกดปุ่ม Select ที่ถูกสรด้านหน้าจากรายการล๊อตงานที่แสดงดังรูปที่ 4.5 หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไข (Revision) ล่าสุดซึ่งข้อมูลทั้งหมดของล๊อตงานนี้จะปรากฏขึ้นทันที พร้อมให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความต้องการ
Primary Actor	ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้, วิศวกรทดสอบ

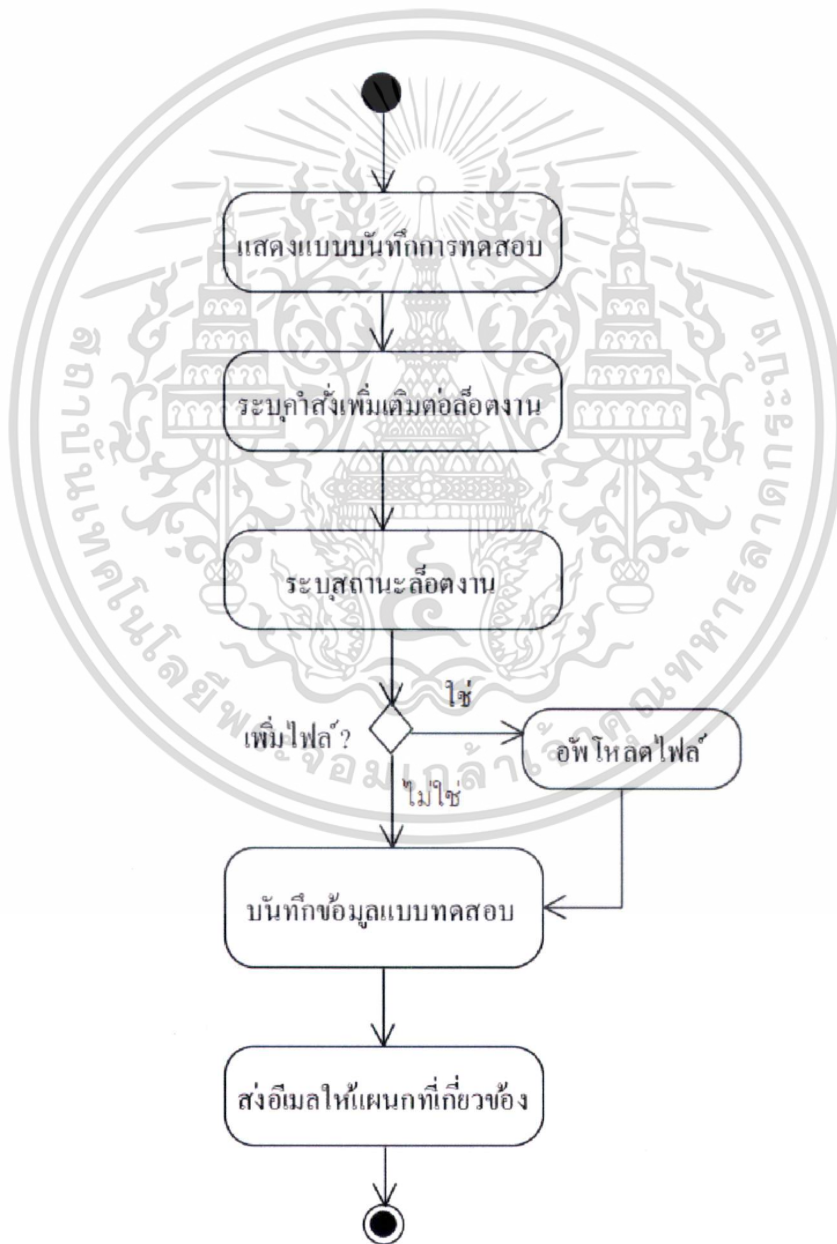
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

Pre-Condition	แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นเพิ่งสร้างใหม่หรือมีอยู่
Post-Condition	แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นมีอยู่หรือเสร็จสิ้น
Basic Flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้เลือกค้นหาแบบบันทึกผลการทดสอบที่ต้องการ 2. ระบบแสดงแบบบันทึกผลการทดสอบที่ต้องการแก้ไขตามยูสเคส ดูแบบบันทึกผลการทดสอบ 3. ผู้ใช้กดปุ่ม Edit เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบบันทึกผลการทดสอบ 4. ระบบอัปเดตแบบบันทึกผลการทดสอบให้เป็นการแก้ไขปรับปรุง (Revision) ถัดไป 5. ระบบอัปเดตข้อมูล Update_Date, Hold_ID โดยใช้วันเดือน ปี และเวลาปัจจุบัน 6. ระบบระบุผู้จัดการแบบบันทึกผลการทดสอบไว้ในส่วนของ Update_User 7. ระบบจัดเก็บความคิดเห็นของการแก้ไขปรับปรุงก่อนหน้าไว้ใน ส่วนของ History_lots ด้านล่างและจัดการช่อง Comment ให้มีค่าว่าง 8. ผู้ใช้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่อง Comment ว่าควรจัดการ ลีตองงานอย่างไร ดังรูปที่ 4.7 หน้าจอแก้ไขเพิ่มเติมแบบบันทึกผลการ ทดสอบ 9. ผู้ใช้ระบุสถานะต่อไปของลีตองงาน ได้แก่ Wait for Retest, Wait for X-Ray, Wait for T/I, Release, Scrap lot เป็นต้น 10. ผู้ใช้ระบุว่าลีตองงานจะถูกส่งถึงแผนกหรือกระบวนการใดถัดไป ได้แก่ Engineering, Manufacturing, Quality Control เป็นต้น 11. ผู้ใช้กดปุ่ม Send/Submit เพื่อยืนยันการส่งต่อลีตองงาน ไปยัง กระบวนการถัดไป 12. ระบบเปลี่ยนสถานะแบบบันทึกผลการทดสอบจากเพิ่งสร้างใหม่ เป็นสถานะมีอยู่ หรือจากสถานะมีอยู่เป็นเสร็จสิ้น

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

Basic Flows	<p>13. ระบบบันทึกแบบบันทึกผลการทดสอบยังฐานข้อมูล</p> <p>14. ผู้ใช้งานระบุเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากรายการอีเมลเพื่อให้รับทราบและดำเนินการตามที่ระบุไว้</p> <p>15. ผู้ใช้งาน Submit เพื่อยืนยันการส่งอีเมลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>16. ระบบส่งอีเมลแจ้งแบบบันทึกผลการทดสอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>
Alternative Flows	-



รูปที่ 4.6 แอกทิวิตีไดอะแกรมการจัดการสื่องานที่กักไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

New		Edit		Submit/Send		Back		Export_xls	
Revision	3	Hold_ID	H20140520203225						
Lot_ID	NE05CAX0	Send to:	Manufacturing						
Batch_ID	CDM783	Status:	Release						
Product	TJA1042	BL_Name	AUTO-AMS						
		FAB_Name	ICN8						
No more reject found with Bond lift issue after T/I. Release lot to next step.									
Comments:									
Information test:									
Tester	SPEAL35	IN:	14208						
Handler	THMUL097	OUT:	14093						
LoadBoard	69093903	Rej:	115						
		YIELD:	99.19 %						
Date/time record:									
Create_Date	2014-05-20 20:32:25			Update_Date	2014-05-24 15:52:30				
Create_User	110001			Update_User	120004				
Add file:									
REF ID	PDF File Name	Choose File No file chosen							
H20140520203225	NE05EAX0_info.pdf	Upload							
H20140520203225	NE05EAX0_x-ray.pdf								
History lots: [NE05CAX0]									
Hold Code	Revision	Lot id	Comment	Status					
→ H20140520203225	2	NE05CAX0	Bond lift issue, send lot to assemble process for T/I.	Wait for T/I					
→ H20140520203225	1	NE05CAX0	Hold due to BIN11>0%,	Wait for FA					

รูปที่ 4.7 หน้าจอแก้ไขเพิ่มเติมแบบบันทึกผลการทดสอบ

4. สร้างผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมได้ โดยข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกสร้างจากรายละเอียดคำอธิบายชุดทดสอบตามตารางที่ 4.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 คำอธิบายยูสเคสการสร้างผู้ใช้งาน

Use Case No.	04
Use Case Name	สร้างผู้ใช้งาน
Description	ระบบตรวจสอบข้อมูล
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
Pre-Condition	ไม่มีชื่อผู้ใช้งาน
Post-Condition	ชื่อผู้ใช้งานมีสถานะเป็นมีอยู่
Basic Flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้งานระบบสร้างข้อมูลผู้ใช้งานโดยระบุชื่อพนักงาน รหัสพนักงาน รหัสผ่าน ตำแหน่ง และอีเมล จากหน้าล็อกอิน 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 3. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูล

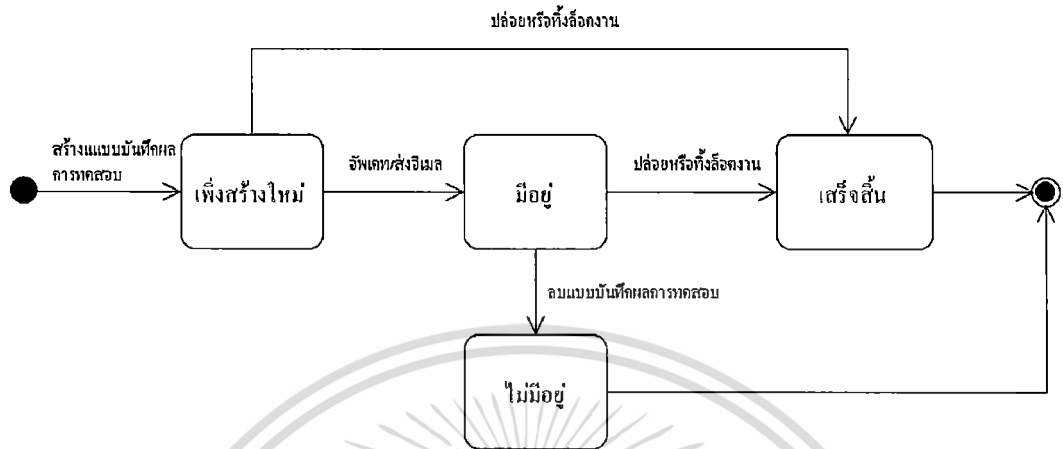
5. **ลบแบบบันทึกผลการทดสอบ** หากรายงานมีการทำซ้ำหรือไม่สมบูรณ์การลบรายงานเกิดขึ้นได้ดังรายละเอียดคำอธิบายยูสเคสตามตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 คำอธิบายยูสเคสการลบแบบบันทึกผลการทดสอบ

Use Case No.	05
Use Case Name	ลบแบบบันทึกผลการทดสอบ
Description	ลบรายงานหากมีการทำซ้ำหรือไม่สมบูรณ์
Primary Actor	ผู้ดูแลระบบ
Pre-Condition	แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นมีอยู่
Post-Condition	แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นไม่มีอยู่
Basic Flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าต้องการลบแบบบันทึกผลการทดสอบออกจากระบบเนื่องจากสาเหตุบางประการ ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของรายงานหรือรายงานไม่สมบูรณ์ 2. ผู้ดูแลระบบลบรายงานออกจากฐานข้อมูล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นอกจากนี้การทำงานของแต่ละยูสเคส ยังสามารถอธิบายสถานะของแบบบันทึกผลการทดสอบได้ดังรูปที่ 4.8 ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานะ ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้



รูปที่ 4.8 สเตทชาร์ตโคออร์เดเนทของแบบบันทึกผลการทดสอบ

จากยูสเคสสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ พนักงานระดับปฏิบัติการสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบเมื่อได้รับคำแนะนำการกักต่องานจาก โปรแกรมประยุกต์เว็บปี, โปรแกรมประยุกต์วินโดว์ซีหรือโปรแกรมประยุกต์วินโดว์ดับเบิลยู โดยจะต้องมีการกำหนดค่าของแบบบันทึกผลการทดสอบให้มีสถานะเป็นเพิ่งสร้างใหม่หลังจากกระทำยูสเคสสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

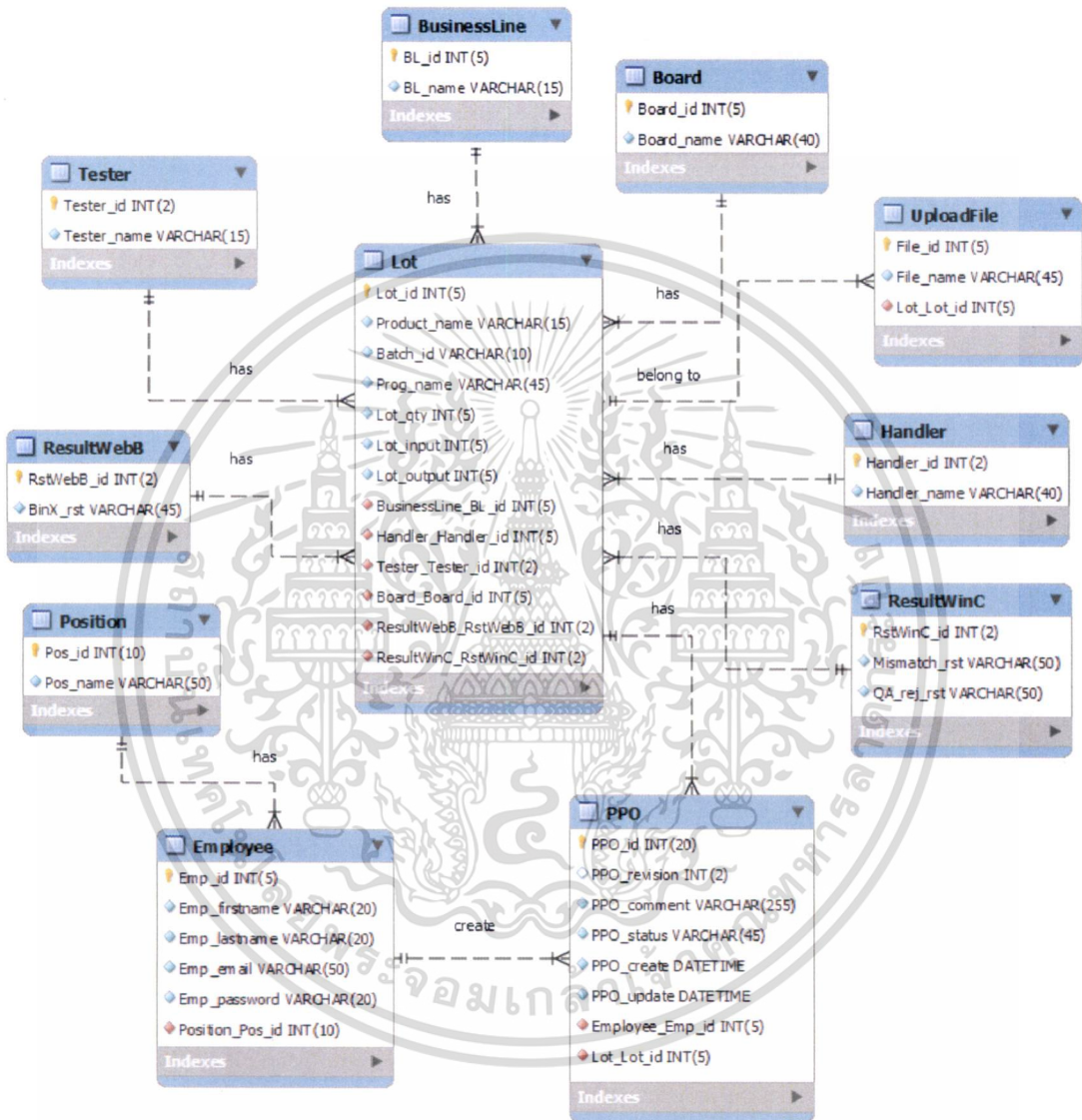
ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้และวิศวกรทดสอบจะตัดสินใจกับล่องงานหลังจากค้นหาล่องงานที่กักไว้จากหน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบดังรูปที่ 4.5 หากวิศวกรทดสอบตัดสินใจว่าสามารถหรือไม่สามารถปล่อยล่องงานไปสู่กระบวนการถัดไปได้ทันทีจะทำให้แบบบันทึกผลการทดสอบเปลี่ยนแปลงจากสถานะเพิ่งสร้างใหม่เป็นเสร็จสิ้นได้

แต่ในกรณีที่ต้องส่งผลการวิเคราะห์การตัดสินใจให้แก่แผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางอีเมลจะทำให้แบบบันทึกผลการทดสอบจะเปลี่ยนสถานะจากเพิ่งสร้างใหม่เป็นมีอยู่ หลังจากนั้นหากล่องงานได้รับการวินิจฉัยว่าสามารถและไม่สามารถส่งไปยังกระบวนการถัดไปเรียบร้อยแล้วจะทำให้แบบบันทึกผลการทดสอบมีสถานะเป็นเสร็จสิ้น

หากผู้ดูแลระบบลบแบบบันทึกผลการทดสอบจากยูสเคสลบแบบบันทึกผลการทดสอบส่งผลให้แบบบันทึกผลการทดสอบเปลี่ยนสถานะจากมีอยู่เป็นไม่มีอยู่

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม ประกอบด้วย แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 อีอาร์ไดอะแกรมของระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม

อีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีของระบบประกอบด้วย 11 เอนทิตี ดังนี้ คือ

1. Employee คือ พนักงาน
2. Position คือ ตำแหน่งพนักงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. BusinessLine คือ ธุรกิจสินค้า
4. Tester คือ เครื่องทดสอบ
5. Handler คือ เครื่องลำเลียงเฟรม
6. Board คือ บอร์ดทดสอบ
7. Lot คือ ล็อตงาน
8. UploadFile คือ เอกสารที่ต้องการจัดเก็บ
9. PPO คือ รายละเอียดแบบบันทึกผลการทดสอบ
10. ResultWebB คือ ผลการตรวจสอบล็อตงานกับโปรแกรมประยุกต์เว็บบี
11. ResultWinC คือ ผลการตรวจสอบล็อตงานกับโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ซี

จากหน้าที่ของระบบจัดการและติดตามผลวงจรรวมข้างต้น สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ กล่าวคือ โดยทั่วไปพนักงานของบริษัท เอ็น แมนูแฟกเจอร์รี่ จำกัดจะมีรหัสพนักงานและอีเมลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้งานระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เมื่อเริ่มกระบวนการทดสอบแผงวงจรรวม พนักงานจะนำล็อตงานเข้าทดสอบตามแต่ละธุรกิจสินค้าที่มีการติดตั้งเครื่องทดสอบ เครื่องลำเลียงเฟรม และบอร์ดทดสอบไว้ในพื้นที่เฉพาะอยู่แล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการติดตั้งดังกล่าววันในกรณีพบการทำงานผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยข้อมูลผลการทดสอบแผงวงจรรวมของแต่ละล็อตงานจะประกอบไปด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์ทดสอบ, รหัสล็อตของแผ่นเวเฟอร์, ชื่อ โปรแกรมทดสอบ, จำนวนงานผลิต, จำนวนงานก่อนทดสอบ, จำนวนงานหลังทดสอบ ข้อมูลผลการทดสอบเหล่านี้จะนำไปตรวจสอบกับโปรแกรมประยุกต์เว็บบีและโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ซีเพื่อตัดสินใจล็อตงานว่าสามารถปล่อยไปยังกระบวนการถัดไปหรือไม่ หากไม่ผ่านผลการตรวจสอบล็อตงานจะถูกกักไว้แผนกทดสอบโดยพนักงานผู้ทำการทดสอบจะล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม จากนั้นสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบขึ้นเพื่อแจ้งวิศวกรทดสอบว่าล็อตงานถูกกักด้วยสาเหตุใด โดยระบบจะส่งข้อมูลผ่านอีเมล ทั้งนี้แบบบันทึกผลการทดสอบสามารถเพิ่มเอกสารแนบเพื่อการประกอบการตัดสินใจให้กับวิศวกรทดสอบได้ จากนั้นวิศวกรจะทำการวิเคราะห์ผลการทดสอบอีกครั้งและแจ้งว่าควรจัดการกับล็อตงานที่กักไว้อย่างไรจนกระทั่งได้รับการวินิจฉัยล็อตงานสามารถหรือไม่สามารถส่งไปกระบวนการถัดไปได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากข้อกำหนดข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดของเอนทิตีในตารางพจนานุกรมได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลพนักงาน (Employee)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	Emp_id	Int(5)	รหัสพนักงาน	PK	
2	Emp_firstname	VarChar(20)	ชื่อพนักงาน		
3	Emp_lastname	VarChar(20)	นามสกุลพนักงาน		
4	Emp_email	VarChar(20)	อีเมลพนักงาน		
5	Emp_password	VarChar(50)	รหัสผ่าน		
6	Pos_id	Int(10)	รหัสตำแหน่ง	FK	Position

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลตำแหน่งพนักงาน (Position)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	Pos_id	Int(5)	รหัสตำแหน่ง	PK	
2	Pos_name	VarChar(50)	ชื่อตำแหน่ง		

ตารางที่ 4.8 ข้อมูลธุรกิจสินค้า (BusinessLine)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	BL_id	Int(5)	รหัสธุรกิจสินค้า	PK	
2	BL_name	Varchar(15)	ชื่อธุรกิจสินค้า		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลเครื่องทดสอบ (Tester)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	Tester_id	Int(2)	หมายเลขเครื่องทดสอบ	PK	
2	Tester_name	Varchar(15)	ชื่อเครื่องทดสอบ		

ตารางที่ 4.10 ข้อมูลเครื่องลำเลียงเฟรม (Handler)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	Handler_id	Int(2)	รหัสเครื่องลำเลียงเฟรม	PK	
2	Handler_name	Varchar(40)	ชื่อเครื่องลำเลียงเฟรม		

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลบอร์ดทดสอบ (Board)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	Board_id	Int(5)	หมายเลขบอร์ดทดสอบ	PK	
2	Board_name	Varchar(40)	ชื่อบอร์ดทดสอบ		

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลล็อตงาน (Lot)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	lot_id	Int(5)	รหัสล็อตงาน	PK	
2	Product_name	Varchar(15)	ชื่อผลิตภัณฑ์ทดสอบ		
3	Batch_id	Varchar(10)	รหัสล็อตของแผ่นเวเฟอร์		
4	Prog_name	Varchar(45)	ชื่อโปรแกรมทดสอบ		
5	Lot_qty	Int(5)	จำนวนงานผลิต		
6	Lot_input	Int(5)	จำนวนงานก่อนทดสอบ		
7	Lot_output	Int(5)	จำนวนงานหลังทดสอบ		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
8	BL_id	Int(5)	รหัสธุรกิจสินค้า	FK	BusinessLine
9	Handler_id	Int(5)	รหัสเครื่องลำเลียงเฟรม	FK	Handler
10	Tester_id	Int(2)	หมายเลขเครื่องทดสอบ	FK	Tester
11	Board_id	Int(5)	หมายเลขบอร์ดทดสอบ	FK	Board
12	RstWebB_id	Int(2)	รหัสรายละเอียดของการ วิเคราะห์ของโปรแกรม ประยุกต์เว็บปี	FK	ResultWebB
13	RstWinC_id	Int(2)	รหัสรายละเอียดของการ วิเคราะห์ของโปรแกรม ประยุกต์วินโดวส์	FK	ResultWinC

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลเอกสารสื่องานที่ต้องการจัดเก็บ (Upload file)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	File_id	Int(5)	รหัสเอกสารสื่องาน	PK	
2	File_name	VarChar(45)	ชื่อเอกสารสื่องาน		
3	Lot_id	Int(5)	รหัสสื่องาน	FK	

ตารางที่ 4.14 ข้อมูลรายละเอียดแบบบันทึกผลการทดสอบ (PPO)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	PPO_id	Int(20)	รหัสสถานะแบบบันทึกผล	PK	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
2	PPO_revision	Int(2)	ครั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติมแบบ บันทึกผล		
3	PPO_comment	VarChar(255)	ความคิดเห็นของการกัก ลือตงาน		
4	PPO_status	VarChar(45)	สถานะของการกักลือตงาน		
6	PPO_create	DateTime	วันที่กักลือตงาน		
7	PPO_update	DateTime	วันที่เปลี่ยนแปลงสถานะ ของการกักลือตงาน		
8	Emp_id	Int(5)	รหัสพนักงาน	FK	Employee
9	Lot_id	Int(5)	รหัสลือตงาน	FK	Lot

ตารางที่ 4.15 ข้อมูลผลการตรวจสอบลือตงานกับ โปรแกรมประยุกต์เว็บปี

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	RstWebB_id	Int(2)	รหัสรายละเอียดการวิเคราะห์ของ โปรแกรมประยุกต์เว็บปี	PK	
2	BinX_rst	Int(45)	รายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีปัญหา BinX มากกว่า ข้อกำหนด		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.16 ข้อมูลผลการตรวจสอบสื่อตงานกับ โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์

ที่	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ตารางอ้างอิง
1	RstWinC_id	Int(2)	รหัสรายละเอียดการวิเคราะห์ของ โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์	PK	
2	Mismatch_rst	Int(50)	รายละเอียดของการวิเคราะห์กรณี ข้อมูลเครื่องทดสอบและเครื่อง ลำเลียงเฟรมไม่ตรงกัน		
3	QA_rej_rst	Int(50)	รายละเอียดของการวิเคราะห์กรณี ไม่ผ่านการทดสอบการประกัน คุณภาพ(QA)		



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

การออกแบบหน้าจอและรายงาน

5.1 การอิมพลีเมนต์ระบบ

การพัฒนาระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมมีการใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์

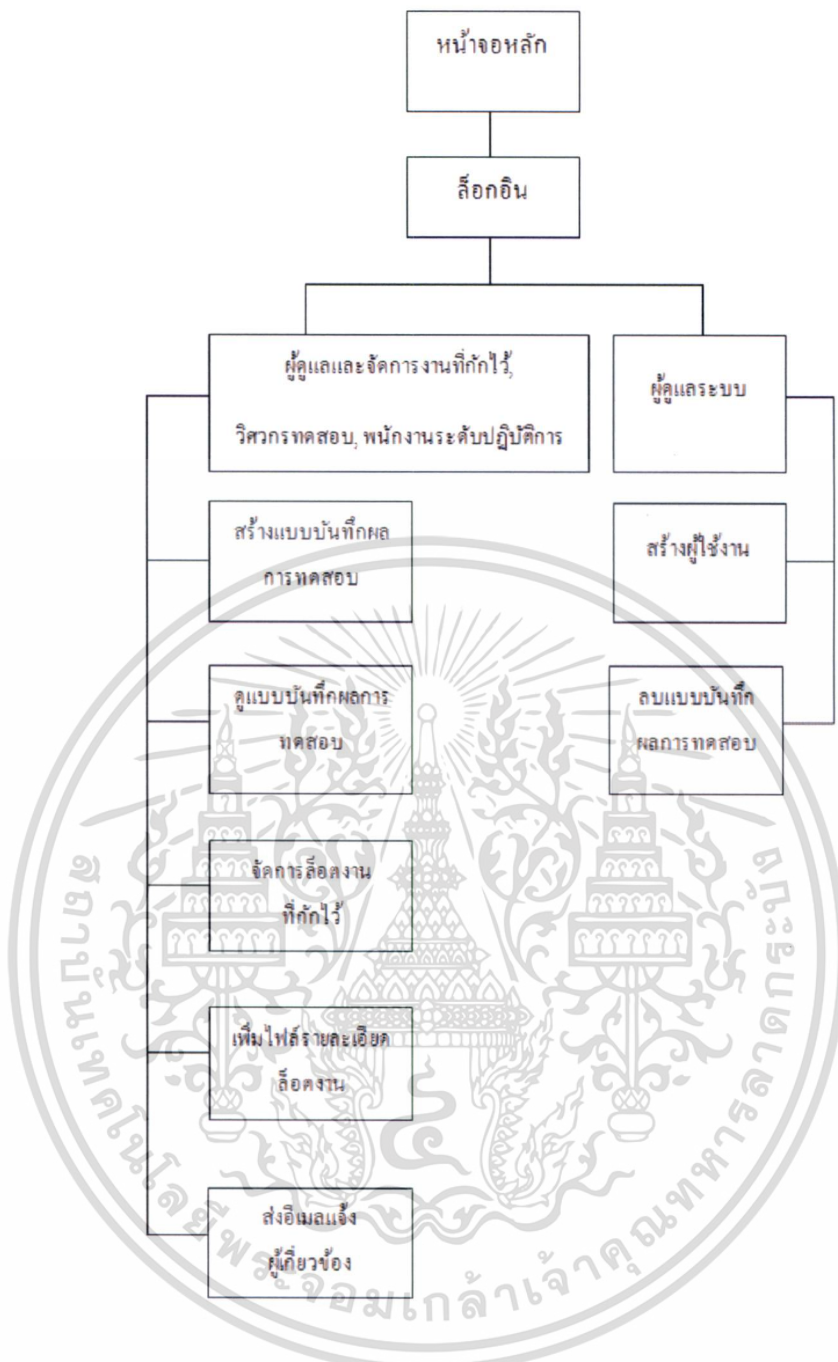
- Notebook DEL LATTITUDE E6460 : Intel(R) Core(TM) I5 CPU@ 2.4 GHz
- RAM 4.00 GB
- Hard disk 200 GB
- Mouse, Keyboard
- DVD multi recorder

2. ซอฟต์แวร์

- Microsoft Office Profession 2007
- Microsoft Window 7 Professional
- Visual Studio 2010
- MS SQL Server 2005
- Google chrome

5.2 การพัฒนาระบบและหน้าจอการทำงาน

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมมีการเตรียมทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยติดตั้ง Window 7 และ IIS Service รวมถึง Visual studio 2010 สำหรับการพัฒนาโปรแกรมภาษา C# และการใช้งานฐานข้อมูลด้วย MS SQL Server 2005 โดยมีแผนผังโครงสร้าง ดังนี้



รูปที่ 5.1 แผนผังโครงสร้างระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวม

จากแผนผังโครงสร้างของระบบ รูปที่ 5.1 สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจากหน้าจอหลักดังรูปที่ 4.5 หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกการทดสอบ
2. ผู้ใช้งานหน้าจอล็อกอิน ดังรูปที่ 5.3 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ ดูแบบบันทึกผลการทดสอบ จัดการลือตงานที่กักไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. ผู้ดูแลและจัดการงานที่กักไว้ สามารถสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ เลือกดูแบบบันทึกผลการทดสอบ จัดการลือตงานที่กักไว้ เพิ่มไฟล์รายละเอียดลือตงาน และส่งอีเมลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

4. วิศวกรทดสอบและพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถเลือกดูแบบบันทึกผลการทดสอบ เพิ่มไฟล์รายละเอียดลือต และส่งอีเมลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกัน ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการทำได้เพียงสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบวงจรรวมเท่านั้น ในขณะที่วิศวกรทดสอบสามารถจัดการลือตงานที่กักไว้ได้

5. ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่สนับสนุนการสร้างผู้ใช้งานและสามารถลบแบบบันทึกผลการทดสอบออกจากฐานข้อมูลได้

การใช้งานตามหน้าจอของระบบ และลำดับขั้นตอนการทำงาน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน

หน้าจอแสดงการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ โดยต้องมีการระบุรหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน รหัสส่วนตัว แผนก ตำแหน่ง และอีเมล ดังรูปที่ 5.2

INTEGRATED CIRCUIT TESTING MANAGEMENT AND TRACKING SYSTEM

[Back to Login Form](#)

Employee No: 120001 *Max 6 digits

Name: Thomas

Password: ***** *Max 8 digits

Department: Engineering

Position: Engineer

Email Address: Thomas@tmats.com

Submit

รูปที่ 5.2 หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน

2. หน้าจอลือตอิน

เมื่อผู้ใช้งานต้องการสร้าง แก้ไข อัปเดต และดูแบบบันทึกผลการทดสอบ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วยหน้าจอดังรูปที่ 5.3 ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องระบุรหัสพนักงานและรหัสส่วนตัว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 5.3 หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ

3. หน้าจอสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ

พนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานดูแลและจัดการงานที่กักไว้ สร้างแบบบันทึกผลการทดสอบเนื่องจากลือตงานไม่ผ่านเงื่อนไขการทดสอบแผงวงจรรวมจาก โปรแกรมประยุกต์เว็บพีหรือโปรแกรมประยุกต์วินโดวส์หรือ โปรแกรมประยุกต์วินโดวส์ดับเบิลยูโดยสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบตามหน้าจอรูปที่ 4.3

4. หน้าจอการส่งอีเมล

สามารถระบุเลือกส่งอีเมลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถัดไปได้ดังรูปที่ 4.4 โดยสามารถเลือกส่งตามอีเมลที่ระบุไว้ได้

5. หน้าจอค้นหาแบบบันทึกผลการทดสอบ

หน้าจอค้นหาและสร้างแบบบันทึกผลการทดสอบ ดังรูปที่ 4.5 รายการลือตงานที่ถูกกักโดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่แสดงไว้ อีกทั้งผู้ใช้งานยังเลือกค้นหาได้จากหลายข้อมูล เช่น วันเดือนปี ชื่อผลิตภัณฑ์ รหัสลือตงาน สถานะของลือตงาน ชื่อธุรกิจผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บทที่ 6

บทสรุป

6.1 สรุปโครงการ

ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานในปัจจุบัน ต้องการลดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งการใช้งานกระทำการทำงานของโปรแกรมประยุกต์เว็บ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ศึกษาข้อจำกัดและปัญหาที่มีอยู่ในขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในระบบงานปัจจุบัน
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ซึ่งจะใช้ยูเอ็มแอลจำลองการทำงานของระบบ
3. การพัฒนาระบบใหม่โดยอาศัยเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์เว็บและสามารถบันทึกรายงานไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงได้
4. พัฒนา ทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตรงตามความต้องการ

6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

จากขั้นตอนการพัฒนาระบบจากโครงการนี้ สรุปได้ดังนี้

1. นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
2. เรียนรู้ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล MySQL, ภาษา C#, โปรแกรมประยุกต์เว็บ

6.3 ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมที่พัฒนาขึ้นให้บริการส่วนแผนกทดสอบเท่านั้นดังนั้นจึงยังไม่ครอบคลุมถึงการติดต่อแผนกอื่นๆ เช่น แผนกส่งออก เพื่อแจ้งเตือนหากล็อตงานถูกกักจนเลยระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งระบบเพียงเก็บข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดสอบแผงวงจรรวมไว้ในฐานข้อมูลเท่านั้นยังไม่สามารถออกรายงานสนับสนุนการตัดสินใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ของผู้บริหารเพื่อการวางแผนต่อกระบวนการทดสอบได้ แต่หากนำการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) หรือกระบวนการทำเหมืองข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ จะทำให้ระบบจัดการและติดตามผลการทดสอบวงจรรวมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- ณัฐพล คล้ายชม. 2556. ความสำคัญของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล. [Onlines]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/103_116/15.html.
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. 2555. อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า. [Online]. เข้าถึงได้จาก: http://www.exim.go.th/doc/research/business/industry_profile/2757.pdf.
- ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. 2555. นาโนอิเล็กทรอนิกส์. [Online]. เข้าถึงได้จาก: <http://library.uru.ac.th/webdb/images/nanotech2.htm>.
- ปรัชญา ศิริภูรี. 2556. วงจรการพัฒนาระบบงานสำหรับระบบสารสนเทศ. [Onlines]. เข้าถึงได้จาก: http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5016/nidz/Web_Analyse/unit2.html.
- วงจรรวม. 2554. [Onlines]. เข้าถึงได้จาก: <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1>.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน	นายพิษณุ เพ็ญสมบุญ
วันเกิด	16 มิถุนายน 2527
สถานที่เกิด	จังหวัดชลบุรี
การศึกษาระดับประถมศึกษา	โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดสงขลา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัทเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอร์ริง(ไทยแลนด์) จำกัด (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้